

CEI 60749-11
(Première édition – 2002)

IEC 60749-11
(First edition – 2002)

**Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**
**Partie 11: Variations rapides de température –
Méthode des deux bains**

**Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –**
**Part 11: Rapid change of temperature –
Two-fluid-bath method**

C O R R I G E N D U M 1

Page 10

Tableau 1 – Tolérances de températures de choc thermique et fluides suggérés

*Sous A – Température
Dans rangée Etape 2 – Tolérance de température*

Au lieu de: $-40 \text{ } ^\circ\text{C}$,

lire: $-40 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Page 11

Table 1 – Thermal shock temperature tolerances and suggested fluids

*Under A – Temperature
In row Step 2 – Temperature tolerance*

Instead of: $-40 \text{ } ^\circ\text{C}$,

read: $-40 \text{ } ^\circ\text{C}$.